Приложение к свидетельству
№ 40890об утверждении типа
средств измерений



Микроскоп атомно-силовой Innova

Внесен в Государственный реестр средств измерений Регистрационный № Ч5021-10

Изготовлен по технической документации фирмы "Veeco Instruments Inc.", США Заводской номер 1В2D3.

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Микроскоп атомно-силовой Innova (далее микроскоп Innova) предназначен для измерений геометрических параметров рельефа поверхности с субнанометровым пространственным разрешением на воздухе и в жидких средах.

Область применения — в лаборатории Центра метрологического обеспечения и оценки соответствия нанотехнологий и продукции наноиндустрии ФГУП «ВНИИОФИ».

ОПИСАНИЕ

Принцип действия микроскопа Innova основан на сканировании исследуемой поверхности зондами, регистрации набора физических величин $\phi_i(x,y)$ и восстановлении по нему геометрии поверхности образца.

В состав микроскопа Innova входят персональный компьютер, контроллер, измерительная головка, набор сканеров, программное обеспечение. В микроскопе Innova реализованы следующие режимы сканирующей зондовой микроскопии:

- полуконтактная атомно-силовая микроскопия,
- контактная атомно-силовая микроскопия,
- электростатическая микроскопия,
- магнитно-силовая микроскопия,
- сканирующая туннельная микроскопия,
- нанолитография.

Программное обеспечение микроскопа Innova защищено от несанкционированного доступа.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров по осям X и Y, %	± 1
Угол между осями сканирования Х и Ү, градус	90,0±0,7
Пределы допускаемой относительной погрешности измерений линейных размеров по оси Z, %	± 5
Величина нелинейности сканирования в плоскости ХУ не более, %	0,5
Величина неплоскостности сканирования по ХҮ не более, нм	80
Номинальное напряжение сети питания, В	220 ± 5%
Габаритные размеры основных составных частей не более, мм - микроскоп Innova - контроллер микроскопа	380x355x355 585x191x585
Условия эксплуатации: - температура окружающего воздуха, °С - относительная влажность воздуха, %	$(22 \pm 0,2)$ (40 ± 2)
Масса, не более, кг	47

ЗНАК УТВЕРЖДЕНИЯ ТИПА

Знак утверждения типа наносится на корпус методом наклейки и на титульный лист руководства по эксплуатации методом печати.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

В комплект поставки входят:

1.	Микроскоп атомно-силовой Innova	1 шт.
2.	Контроллер микроскопа	1 шт.
3.	Персональный компьютер	1 шт.
4.	Монитор	2 шт.
5.	Сканер с рабочим диапазоном 100 мкм	1шт.
6.	Сканер с рабочим диапазоном 5 мкм	1шт.
7.	Руководство по эксплуатации	1 экз.
8.	Методика поверки	1 экз.

ПОВЕРКА

Поверка микроскопа Innova осуществляется в соответствии с документом «Микроскоп атомно-силовой Innova фирмы Veeco Instruments Inc. Методика поверки", утвержденным ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМС» в сентябре 2010 г.

Основные средства поверки:

- мера периода и высоты линейная TGQ1 (Госреестр № 41680-09);
- мера периода и высоты линейная TGZ3 (Госреестр № 41678-09).

Межповерочный интервал - один год.

НОРМАТИВНЫЕ И ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Техническая документация фирмы-изготовителя «Veeco Instruments Inc.», США.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Тип микроскопа атомно-силового Innova утвержден с техническими и метрологическими характеристиками, приведёнными в настоящем описании типа, и метрологически обеспечен в эксплуатации.

Изготовитель:

Фирма «Veeco Instruments Inc.», США

112 Robin Hill Road Santa Barbara CA 93117 USA

Attn.: Service Center

Phone: (805) 967-2700 Fax: (805) 967-7717

www.veeco.com

Заявитель:

ФГУП «ВНИИОФИ», 119361, г. Москва, ул. Озерная, 46.

Заместитель директора ФГУП «ВНИМ

Ю.М. Золотаревский